

	ITEM	Symbol	Standard
1	High Temperature Operating Life Test	HTOL	JEITA ED4701-101A
2	High Temperature Storage Life Test	HTSL	JESD22-A103E
3	Precondition	PC	JESD22-A113G
4	Temperature Cycle Test	TCT	JESD22-A104E
5	Highly-Accelerated Temperature and Humidity Stress Test	HAST	JESD22-A110E
6	Electrostatic Discharge Test	HBM	JESD22-A114F
7		CDM	JESD22-C101F
8	Latch-Up Test	LUT	JESD78D

試験方法	判定基準	備考
HBM (human body model)	印加電圧 ±500V 以下で破壊無きこと	・JEITA EIAJ ED-4701/304」に準拠します。 ・人体が静電気帯電物体となり、デバイスの端子に接触し皮膚を介して静電気放電すること起因したモデルです。
CDM (charged device model)	印加電圧 ±500V 以下で破壊無きこと	・「JEDEC JESD22-C101C」に準拠します。 ・デバイスが静電気帯電物体となり、ピンセットなどの導体に接触して放電すること起因したモデルです。 ・JEDEC 方式で試験できない場合は JEDEC 方式の判定基準電圧を満たす電圧を算出し判定して下さい。 ＜参考：代表的な試験方式で算出した基準電圧＞ JEITA EIAJ ED-4701/305 ±750V で破壊無きこと AEC-Q100-Q11 ±400V で破壊無きこと ESDA STM 5.3.1 ±350V で破壊無きこと
カセット帯電モデル [10pF-0Ω]	印加電圧 ±800V 以下で破壊無きこと	・松下電器産業と阪和電子工業で開発したゲームカセットのような小容量の静電気帯電物体からの急峻な放電波形を想定したモデルです。
パルス電流印加法	印加電流 100mA 以下で超過無きこと	・「JEDEC STD No.78」に準拠 ・温度条件は不問とします。 ・パルス電流印加後の消費電流が、最大消費電流（仕様書の数値）を超過した場合、ラッチアップと判断して下さい。 ・仕様書に明記されていない場合は、下記のいずれか大きい方を判定値として下さい。 Inow+10mA 又は 1.4 × Inow (Inow:試験前の消費電流)

PreCondition details

	Condition	Flow
1	-65℃～150℃/10 Cycles	Temperature Cycling
2	125℃/24hrs	Baking
3	30℃/60%RH/192hrs(MSL3)	Moisture Soaking
4	260+0/-5℃@3times	IR Reflow